06;11;12

Аморфные пленки кремния и германия для неохлаждаемых микроболометров

© Т.А. Енукова, Н.Л. Иванова, Ю.В. Куликов, В.Г. Маляров, И.А. Хребтов

ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", С.-Петербург

Поступило в Редакцию 17 февраля 1997 г.

Представлены результаты экспериментального анализа возможности применения в неохлаждаемых микроболометрах аморфных пленок кремния и германия, изготовленных методом магнетронного распыления. Получены пленки *a*–Si и *a*–Ge, имеющие энергию активации и удельное сопротивление, равные 0.135 и 0.2 эВ, и 50 и 0.4 кОм · см соответственно.

Среди осуществляемых программ по инфракрасной технике видное место в последние годы отводится разработкам неохлаждаемых многоэлементных приемников и, в первую очередь, микроболометрических матриц [1–4]. Такие матрицы по чувствительности в области спектра 8–14 мкм приближаются к криогенным фотонным многоэлементным линейкам и выгодно отличаются от них более низкой стоимостью и лучшими эксплуатационными характеристиками, что обусловливает широкие перспективы их использования.

Одной из основных проблем создания высокочувствительных неохлаждаемых микроболометров для инфракрасной матрицы является получение пленочного термочувствительного элемента размерами $40 \times 40 - 100 \times 100$ мкм, обладающего сопротивлением 5–30 кОм, низким уровнем избыточного шума и высоким температурным коэффициентом сопротивления при комнатной температуре (1–3%/K). Кроме того, технология изготовления такого элемента должна сочетаться с современной технологией кремниевых микросхем. С учетом этих требований перспективны аморфные пленки кремния и германия [2,4].

Наибольшее распространение получили два типа структуры чувствительного элемента микроболометра — планарная (щелевая) и сэндвичная [1,2]. Первая структура предполагает расположение термочувствительной пленки в планарном зазоре между двумя участками металлической пленки, выполняющими функции электродов, а вто-

21

рая — формирование термочувствительного слоя между верхним и нижним пленочными электродами. Для изготовления микроболометра планарного типа термочувствительная пленка должна иметь удельное сопротивление (ρ) порядка 1–10 Ом · см при комнатной температуре. Для микроболометров сэндвичной структуры требуются пленки с $\rho = 5-50$ кОм · см. Объектом исследований данной работы были пленки аморфных кремния и германия (a-Si, a-Ge), получаемые методом магнетронного распыления.

Пленки *a*–Si толщиной ~1 мкм получали распылением мишени из кремния марки КЭФ с удельным сопротивлением 60 Ом · см с помощью планарного магнетрона в атмосфере аргона. Магнетрон работал на постоянном токе разряда. Перед каждым напылением вакуумная камера откачивалась до давления $7 \cdot 10^{-7}$ Top, рабочее давление Ar поддерживалось с помощью сорбционного насоса, который откачивался перед напылением вместе с камерой. Из-за отсутствия в системе охлаждения температура подложки в процессе напыления (~1 час) могла повышаться до 80–200°C в зависимости от мощности разряда. Пленки наносили на ситалловые подложки с напыленными планарными платиновыми электродами и одновременно на кремниевые пластины с изолирующим SiO₂ слоем. Во втором варианте, с использованием съемных медноникелевых масок, получали 8 сэндвич-структур площадью 100×100 мкм² за одно напыление. Электродами в этих образцах служили пленки титана.

Оценку свойств образцов проводили путем измерения температурной зависимости сопротивления и спектров шума. Температурную зависимость сопротивления измеряли на постоянном токе 1–5 мкА. Спектры шума исследовали в диапазоне частот 10 Гц–1 кГц с использованием малошумящего предварительного усилителя и анализатора спектра СК4-56.

Свойства термочувствительных пленок зависели от давления Ar и мощности разряда. Магнетронный источник работал устойчиво в интервале давлений $1 \cdot 10^{-2} - 3 \cdot 10^{-3}$ Top. Удельное сопротивление осаждаемых пленок при этом менялось от 10^9 до 10^6 OM · см. Однако пленки с $\rho = 10^6$ OM · см, полученные при низких давлениях, могли отслаиваться на воздухе из-за сильных сжимающих внутренних напряжений. Оптимальным было давление $1 \cdot 10^{-2}$ Top. Получить пленки с $\rho = 10^6$ OM · см удалось увеличением разрядного тока от 50 до 100–120 мА. Дальнейшее увеличение разрядного тока не приводило к снижению величины удельного сопротивления.

Сопротивление и энергия активации проводимости (E_t) пленок a-Si зависят также от степени легирования материала мишени [5]. С целью дальнейшего снижения величины ρ была использована мишень из кремния марки КЭС с удельным сопротивлением 0.02 Ом · см. С этой мишенью в планарной конфигурации электродов получили пленки с $\rho = 90-50$ кОм · см и $E_t = 0.135$ эВ (температурный коэффициент сопротивления 1.8%/К при 25°С), что при условии отсутствия анизотропии свойств пленок было бы удовлетворительным для микроболометров сэндвичной структуры. Однако значение ρ сэндвич-структур на порядок и более превосходили значения ρ планарных структур, полученных за одно напыление. Сопротивления сэндвичных образцов одной серии при измерительном токе ~1 мкА различались в 10–20 раз и зависели как от величины тока, так и от его направления.

На рис. 1 приведен пример температурных зависимостей сопротивления одного из сэндвичей (образец 4–1) при разных направлениях измерительного тока ~2 мкА. При одном направлении тока найдена $E_t = 0.295$ эВ, а при другом — 0.051 эВ (температурный коэффициент сопротивления при 25°С 3.8 и 0.7%/К соответственно). Мы полагаем, что такой эффект мог возникнуть из-за влияния барьерных несимметричных контактов типа Ti–TiO–Si на одной стороне и Si–SiO–Ti на другой стороне сэндвич-структуры. Это предположение подтвердилось измерением вольт-амперных характеристик структур.

В сэндвичном образце 4–6А (рис. 1) площадью 0.9 мм^2 вместо верхнего напыленного Ті электрода мы использовали электрод из сплава Вуда. Энергия активации этого образца (0.13 эВ) была близка к E_t планарного образца, а сопротивление при комнатной температуре превышало значение, подсчитанное по ρ планарного образца на 20 кОм, хотя и оставалось практически тем же при смене направления измерительного тока. Это также подтверждало предположение о несимметричных барьерных эффектах. Не случайно, что зарубежные разработчики, наблюдавшие подобные эффекты, пришли к однокамерному напылению сэндвич-структур без развакуумирования [2]. Спектры шума образца 4–6А при разных токах представлены на рис. 2. Шум имеет явно токовую природу и частотную зависимость $1/f^{1.1}$. При указанных токах напряжение измеренного шума сопротивления и обусловлено, по нашему мнению, неомичностью контактов.

С целью уменьшения влияния окислов на границе металл-полупроводник перед напылением пленки *a*-Si подложку с Ti электродом



Рис. 1. Температурная зависимость сопротивления пленочных образцов *a*–Si и *a*–Ge (6–1). Образцы 4–1, 5–8 и 4–6А имеют сэндвич-конфигурацию площадью 0.01, 0.01 и 0.9 мм² соответственно; образец 6–1 — планарную конфигурацию и площадь рабочего участка термочувствительной пленки 8 мм². Знаки (+) и (–) указывают на разные направления измерительного тока.

подвергли легкому травлению в плазме тлеющего разряда в Аг. Перед нанесением верхнего Ті электрода в другой установке также провели очистку поверхности пленки *a*–Si в Ar (образец 5–8, рис. 1). Сопротивления образцов этой серии отличались не более чем в 2.5 раза и имели $E_t = 0.12$ эВ, т.е. практически такую же, как у образца 4–6 А. Изменение сопротивления при смене направления тока составляло 5–9%.



Рис. 2. Спектры напряжения шума образца 4–6А при разных токах: *1* — 1.1 мкА; *2* — 2.2 мкА; *3* — 4.4 мкА; *4* — 6.7 мкА; *5* — 11.1 мкА.

Для получения пленок аморфного кремния с более низким удельным сопротивлением, вплоть до 10 Ом · см, в условиях нашего эксперимента требуется тщательный контроль состава остаточной атмосферы в вакуумной камере и чистоты используемого аргона. Наличие в камере водорода, кислорода, паров воды приводит к пассивации этими газами оборванных связей в аморфном кремнии, в результате чего осаждается пленка аморфного гидрированного кремния, материала с другими электрическими и оптическими свойствами [6].

Использование в качестве материала распыляемой мишени германия позволяет достичь тех же значений E_t , что и с кремнием, но при более низких удельном сопротивлении и уровне шума [4]. Это подтвердилось

результатами распыления мишени из монокристаллического Ge марки ГМО с удельным сопротивлением 50 Ом · см в тех же условиях, в каких были получены пленки a-Si. Осаждение провели на подложку из ситалла с планарной конфигурацией электродов. При $\rho = 4 \cdot 10^2 \, \mathrm{Om} \cdot \mathrm{cm}$ полученный образец (6–1) имел $E_t = 0.2$ эВ. Удельное сопротивление пленки а-Ge отличалось от сопротивления используемой мишени всего в 8 раз (в случае кремния — 4 порядка). Это свидетельствует о том, что Ge менее чувствителен к паразитным остаточным газам, чем кремний. Более того, для данного материала пассивация оборванных связей водородом является желательной для получения оптимального удельного сопротивления. Например, в статье [7] показано, что пленки аморфного гидрированного германия, полученные при добавлении к Ar 10% H₂, имеют ρ до 10⁵ Ом · см и $E_t = 0.42$ эВ. Перспективным является также получение пленок *a*-Si_xGe_{1-x} путем совместного распыления кремния и германия. Меняя соотношение Si и Ge в распыляемой мишени, можно получить пленки с широким выбором комбинаций ρ и E_t .

В результате проведенной работы методом магнетронного распыления получены пленки a-Si и a-Ge, имеющие температурный коэффициент сопротивления от 1.6 до 2.6%/К при 25°, что соответствует температурному коэффициенту сопротивления микроболометров зарубежных неохлаждаемых матриц [1–4]. Достижение требуемого удельного сопротивления и энергии активации пленок a-Ge проще, чем пленок a-Si. Технология получения омических малошумящих контактов этих термочувствительных пленок с электродами требует дальнейшей проработки.

Список литературы

- [1] Wood R.A., Foss N.A. // Lazer Focus World. 1993. V. 29. N 6. P. 101-106.
- [2] Unewisse M.H., Graig B.I., Watson R.J., Liddiard K.C. // Proc. SPIE. 1995.
 V. 2554. P. 43–45.
- [3] Marshall C., Butler N., Blackwell R., Murphy R., Breen T. Proc. SPIE. 1996.
 V. 2746. P. 23–31.
- [4] Unewisse M.H., Liddiard K.C., et al. // Proc. SPIE. 1995. V. 2552. P. 77-87.
- [5] Pawlewicz W.T. // J. Appl. Phys. 1978. V. 49. N 11. P. 5595-5601.
- [6] Иванова Н.Л., Никитин В.В., Онохов А.П. // Оптический журнал. 1993. N 7. С. 45–49.
- [7] Nquyen Van Dong, Tran Quoc Hai // Phys. Stat. Sol. (b). 1978. V. 88. N 2.
 P. 355–561.